03,11,13

Исследование структуры и состава пленочных золь-гель-систем CoO_x–SiO₂

© В.С. Левицкий^{1,2}, А.И. Максимов², В.А. Мошников², Е.И. Теруков^{1,2}

 ¹ Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
² Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ",

Санкт-Петербург, Россия

E-mail: lev-vladimir@yandex.ru

(Поступила в Редакцию 13 марта 2013 г. В окончательной редакции 11 июля 2013 г.)

> Методами золь-гель технологии были получены образцы Si-Co-O в диапазоне составов от 15 до 90% содержания кобальта. Результаты атомно-силовой микроскопии показывают, что предварительное центрифугирование растворов позволяет управлять размерами наносфер, получаемых на стадии формирования золя. Для диагностики фазового состава пленочных и объемных материалов использовалась рамановская спектроскопия и рентгенофазовый анализ. Результаты рентгенофазового анализа и рамановской спектроскопии показывают, что наносферы принадлежат к фазе шпинели Co₃O₄. Наблюдается корреляция между положением максимумов рамановских полос и размерами наносфер.

> Работа финансировалась Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом "ЛЭТИ".

1. Введение

В настоящее время золь-гель-метод является одним из основных методов получения аморфных материалов, керамики и стеклокерамики. Стекловидные пленки, получаемые этим методом с конца 60-х годов, успешно применяются в технологии микроэлектроники. Золь-гель-технология также используется для получения наноструктурированных слоев с магнитными свойствами [1,2].

Из многообразия золь-гель-методов в полупроводниковом материаловедении наибольшее распространение получил метод синтеза с использованием в качестве прекурсора тетраэтоксисилана (ТЭОС) и в качестве функциональных добавок — солей металлов (растворимые хлориды и нитраты). При этом растворителем служат спирты (изопропиловый или изобутиловый). ТЭОС является неоднородной составляющей композита. Он создает прочное адгезионное соединение со стеклянными или кремниевыми подложками. В процессе гелеобразования и последующей термообработки композиционного материала ТЭОС переходит в неорганический оксид кремния SiO₂. Функциональные добавки формируют сплошные или перколяционные структуры [3]. Диагностика фазового состава получаемых таким образом структур представляет собой сложную актуальную задачу, так как кроме кристаллических включений в композите присутствуют аморфные фазы, как твердые, так и жидкие [4]. Для обеспечения оптимальных физических свойств получаемого материала необходимо контролировать полноту протекания химических реакций, отвечающих как за формирование геля, так и окончательных композиционных структур при отжиге. Такой метод был предложен в [4]. Он позволяет оценивать полноту протекания реакции гидролиза и поликонденсации, а также наличие в составе капсулированных в сетке геля нанофаз. Однако он не применим для диагностики фаз с высокой температурой плавления, входящих в нанокомпозит.

В настоящей работе получены кобальтсодержащие композиты с адгезионным аморфным слоем SiO₂. Проведены исследования полученных нанокомпозитов с использованием методик рамановской спектроскопии, рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) и рентгенофазового анализа (РФА). Показано, что для анализа состава оболочек наносфер наиболее информативным методом является рамановская спектроскопия.

2. Технология формирования материалов в системе Si–Co–O

В работе использовался золь-гель-метод для получения кобальтсодержащих композитов в виде пленочных структур и порошков [3]. Оптимальное соотношение основных компонентов в исходном растворе обеспечивает быстрый частичный или полный гидролиз, с сохранением образующихся продуктов в виде золя [5,6].

В качестве исходных компонентов для синтеза зольгель-систем использовались следующие прекурсоры: источником кобальта для формирования оксида в композите служил хлорид кобальта $CoCl_2^*6H_2O$, а источником SiO_2 — тетраэтоксисилан $Si(OC_2H_5)_4$. Для синтеза золей 1 mole $CoCl_2^*6H_2O$ растворяли в 96 moles спирта.

Проведены синтезы и исследования систем растворовзолей следующих составов (в пересчете на moles%): $50SiO_2 - 50CoO_x$, $85SiO_2 - 15CoO_x$, $70SiO_2 -$ $30CoO_x$, $30SiO_2$ — $70CoO_x$, $15SiO_2$ — $85CoO_x$, $10SiO_2$ — $90CoO_x$.

Следует отметить, что составы золей транслируются в получаемый на последующих этапах нанокомпозит.

Полученные золи использовали для формирования объемных, порошковых и пленочных нанокомпозитных материалов. Для получения порошковых образцов, в случае использования ТЭОС, ускорение гелеобразования достигалось введением необходимого объема водного раствора аммиака. Органический растворитель испарялся при комнатной температуре в течение нескольких десятков часов в зависимости от объема раствора. Порошки-ксерогели, полученные с использованием ТЭОС, прошли температурную обработку в условиях T = 400 и 600° С и t = 60 min.

Получение пленочных композиционных слоев на различных типах подложек проводилось методом центрифугирования с использованием центрифуги "MiniSpin". Скорость вращения центрифуги составляла 3000, 5000 и 10 000 min⁻¹. Выдержка растворов золей проводилась при комнатной температуре в течение 1, 7 и 20 дней. После нанесения пленки на подложку производилась термообработка при 400°С.

В качестве подложек использовались стекло покровное и кремний марки КЭФ-3[111].

Стеклянные подложки проходили несколько ступеней очистки в следующей последовательности: дистиллированная вода — этиловый спирт — дистиллированная вода — соляная кислота — дистиллированная вода.

Очистка кремниевых подложек также проводилась в несколько этапов: дистиллированная вода — этиловый спирт — дистиллированная вода — плавиковая кислота — дистиллированная вода.

3. Результаты, полученные с использованием атомно-силовой микроскопии

Все пленки, прошедшие термообработку, были исследованы с помощью атомно-силового микроскопа НТ-МДТ ИНТЕГРА ТЕРМА. Исследования образцов проводились в полуконтактном режиме. Разрешение такого режима работы соответствует радиусу закругления зонда ~ 10 nm.

Исследование крупных агломератов с помощью атомно-силового микроскопа показало, что они обладают сложной структурой. На рис. 1 и 2 приведены изображения типичных агломератов, находящихся на поверхности пленки. Детальный анализ пленки вне частиц и больших агломератов указывает на наличие пор с размером менее 10 nm [5].

Установлено, что при использовании в качестве функциональных наполнителей металлических компонентов в процессе термоотжигов возможны образования оксидных фаз, составляющих либо оболочку металлической частицы, либо сферически-полые микро- и нанострукту-



Рис. 1. Топография пленочного образца состава 70%СоО–30%SiO₂, время выдержки раствора-золя 1 день, подложка — стекло, масштаб микрофотографии $5 \times 5 \mu$ m.







Рис. 3. Топография пленочного образца состава 50%CoO-50%SiO₂, время выдержки раствора-золя 7 дней, подложка стекло, масштаб микрофотографии $5 \times 5 \mu$ m.



Рис. 4. a — топография пленочного образца Со901, масштаб микрофотографии $2 \times 2\mu$ m, скорость предварительного центрифугирования 1000 min⁻¹. b — топография пленочного образца Со903, масштаб микрофотографии $5 \times 5\mu$ m, скорость предварительного центрифугирования 3000 min⁻¹. c — топография пленочного образца Со907, масштаб микрофотографии $10 \times 10 \mu$ m, скорость предварительного центрифугирования 7000 min⁻¹. d — топография пленочного образца Со907, масштаб микрофотографии $10 \times 10 \mu$ m, скорость предварительного центрифугирования 7000 min⁻¹. d — топография пленочного образца Со900, масштаб микрофотографии $10 \times 10 \mu$ m, без предварительного центрифугирования.

ры [6]. На рис. 1, 2 приведены примеры вскрытых микросфер, в полостях которых содержатся нанокристаллы.

Как видно из рис. 3, мелкие частицы агломерируются в крупные вскрытые микросферы. Образование вскрытых микросфер на поверхности подложки может происходить по разным причинам. Одной из причин может являться высокая температура отжига, когда полая микросфера может взорваться из-за сильного внутреннего давления. Другой причиной может быть незавершенность процесса кластер-кластерной агрегации, когда система не успевает прийти в равновесие, и на подложку оседают только успевшие образоваться части микросферы.

Для удаления крупных агломератов из состава некоторых золей был использован метод предварительного центрифугирования золя. В процессе вращения под действием центростремительных сил крупные агломераты, обладающие большей массой, оседали на дно и стенки сосуда, в то время как в золе оставались мелкие частицы.

Влияние предварительного центрифугирования на структуру пленок

Результаты проведенных исследований показывают, что увеличение скорости предварительного ценрифугирования позволяет уменьшать размеры частиц.

На рис. 4, *a*-*d* представлены микрофотографии, сделанные с помощью атомно-силовой микроскопии, поверхности пленок, получившихся в результате нанесения растворов и прошедших процедуру предварительного центрифугирования.

Сравнивая рис. 4, a и 4, b, можно отметить, что размер получившихся агломератов составил ~ 50 nm, a их формы — подобны и напоминают уменьшенную копию крупного агломерата, изображенного на рис. 1. Также видно, что каждый агломерат состоит в свою очередь из трех более мелких частиц.

При увеличении скорости предварительного центрифугирования до 7000 min⁻¹ получившаяся пленка состоит из наночастиц со средним размером ~ 3 nm (рис. 4, *c*). Высокой плотности упаковки частиц на поверхности достигали путем снижения скорости вращения центрифуги в процессе нанесения пленки [5].

Исследования методами РФА и РСМА

Анализ порошковых образцов, предварительно отожженных при температурах 400° C (рис. 5), показал наличие кристаллической структуры состава Co₃O₄ со структурным типом шпинели. В некоторых порошковых образцах наблюдались следы хлоридов, входивших в первоначальный состав прекурсоров. Этот эффект является следствием неполного удаления продуктов реакции при отжиге.

Порошки, содержащие нанокристаллы Co₃O₄, были использованы в дальнейших экспериментах в качестве стандарта для идентификации фазы Co₃O₄ в рамановском спектре.

Исследования с использованием РСМА показали, что Со равномерно распределяется в пленке, однако в агломератах концентрация Со повышена [6].

Результаты рамановской спектроскопии

Рамановские спектры образцов были получены с использованием спектрометра Jobin-Yvon Horiba T64000. Измерения проводились при комнатной температуре. В качестве источника возбуждения использовали Nd: YAG-лазер с длиной волны излучения 532 nm. Лазерный луч был сфокусирован на образце в пятно диаметром 1μ m. Мощность излучения на поверхности образца составила P = 0.5 mW. Объектив с увеличением × 100 использовался для фокусировки возбуждающего света (532 nm), а также для сбора рассеянного света. Вид рамановских спектров для образцов, прошедших процедуру предварительного центрифугирования, приведен на рис. 6, *а* и *b*.

На рис. 6, *а* приведены серии измерений, выполненные как на чистой подложке (Si), так и на исследуемых слоях. Анализ рамановских спектров (кривые *1*–4) показал, что на подложке присутствуют частицы Co₃O₄ [7–10].



Рис. 5. Дифракционная картина порошкового образца состава 70%CoO-30%SiO₂.



Рис. 6. *а* — рамановские спектры серии Со700–Со707, общий вид. *b* — рамановские спектры серии Со900–Со907, полоса A_{1g} .

Известно [7], что наиболее интенсивная полоса, соответствующая колебанию симметрии A_{1g} , от Co₃O₄ располагается в районе 680–700 cm⁻¹. Полоса 522 cm⁻¹, относящаяся к колебанию симметрии F_{2g} , решетки Co₃O₄, накладывается на полосу 520 cm⁻¹ кристаллического кремния, который использовался в качестве подложки.

На рис. 6, b видна слабая асимметрия полосы A_{1g} . Наличие такой асимметрии можно объяснить существованием наноразмерных агломератов оксида кобальта в

Фононные моды	A_{1g}		F_{2g}		E_g		F_{2g}	
№ образца	$\omega_{691}, \mathrm{cm}^{-1}$	$\sigma_{691}, \mathrm{cm}^{-1}$	$\omega_{618}, \mathrm{cm}^{-1}$	$\sigma_{618}, \mathrm{cm}^{-1}$	$\omega_{483}, \ {\rm cm}^{-1}$	$\sigma_{483}, \ {\rm cm}^{-1}$	$\omega_{194}, \mathrm{cm}^{-1}$	$\sigma_{194}, \mathrm{~cm}^{-1}$
900	688	9	619	8	482	8	194	5
901	692	8	621	7	484	6	195	5
903	691	7	620	6	483	6	195	4
907	690	7	620	6	483	6	194	4

Таблица 1. Серия образцов состава 90%СоО_х

Таблица 2. Серия образцов состава 70%СоО_х

Фононные моды	A_{1g}		F_{2g}		E_g		F_{2g}	
№ образца	$\omega_{691}, \mathrm{cm}^{-1}$	$\sigma_{691}, \mathrm{cm}^{-1}$	$\omega_{618}, \mathrm{cm}^{-1}$	$\sigma_{618}, \mathrm{cm}^{-1}$	$\omega_{483}, \ {\rm cm}^{-1}$	$\sigma_{483}, \ {\rm cm}^{-1}$	$\omega_{194}, \mathrm{cm}^{-1}$	$\sigma_{194}, \mathrm{cm}^{-1}$
700	689	9	620	8	483	7	195	5
701	690	7	621	6	483	5	195	5
703	689	9	619	8	483	6	194	5
707	689	9	620	7	483	6	194	6

пленке и, как следствие, нарушением правил отбора по импульсу [11]. Для определения размеров получаемых агломератов, используя метод рамановской спектроскопии, необходимо знать дисперсию фононов соответствующего материала, однако в современной литературе таких данных не было обнаружено. В табл. 1 и 2 приведены положения максимумов (ω_x) и ширин на полувысоте (σ_x) для каждой полосы.

На рис. 7 приведена зависимость положения максимума полосы A_{1g} от размеров агломератов. Размер агломерата определялся из АСМ микросканов. Из рис. 7 видно, что положение максимума сдвигается в сторону уменьшения частоты при уменьшении размеров получаемых агломератов. Сдвиг положения максимума в сторону уменьшения частоты может являться следствием уменьшения размеров агломератов [12,13].

Однако в наших экспериментах не все образцы попадают под отмеченную закономерность (рис. 6, b, кривая 1 — образец без предварительного центрифугирования). Из табл. 1 и рис. 6, b видно, что у данной кривой наибольшее значение ширин на полувысоте. Этот факт



Рис. 7. График зависимости положения максимума полосы A_{1g} от размера кристалла Co₃O₄.

может быть следствием того, что в образце без предварительного центрифугирования присутствует большой разброс по размерам агломератов [3]. Анализируя ширины полос остальных образцов (кривые 2-4), можно отметить, что с увеличением скорости предварительного центрифугирования полосы сужаются. Это говорит о том, что разброс размеров агломератов на поверхности пленки становится меньше, чем при создании пленок без предварительного центрифугирования.

7. Заключение

Результаты атомно-силовой микроскопии показывают, что в зависимости от технологии синтеза и обработки материалов, варьируя такими параметрами, как скорость предварительного центрифугирования и время выдержки растворов, можно управлять размерами получаемых наносфер.

По данным ACM видно, что крупные агломераты состоят из более мелких. Предварительное центрифугирование на высоких скоростях вращения позволяет подавить агломерацию и осадить крупные частицы на дно раствора, оставляя в объеме только мелкие отдельные наносферы. Образцы, полученные с помощью предварительного центрифугирования, показывают высокую сплошность и однородность пленки.

Установлено, что в процессе термоотжига возможно образование оксидных фаз, составляющих либо оболочку металлической частицы, либо сферически-полые микро- и наноструктуры.

Наблюдается корреляция между положением рамановского пика и размерами наносфер.

Следует отметить, что оба метода, как РФА, так и рамановская спектроскопия, зафиксировали наличие фазы Co₃O₄ в структуре шпинели, как в пленочных образцах, так и в объемных композитах.

Авторы выражают благодарность В.Ю. Давыдову и А.Н. Смирнову за предоставленные рамановские спектры.

Список литературы

- [1] H. Chengliang, Zh. Xiao-Ping. Magnetic Sensors Principles and Applications **8**, 67 (2012).
- [2] A. Dromota, M. Drofenik, J. Koselj, A. Žnidaršič. Microemulsions — An Introduction to Properties and Applications / Ed. Dr. Reza Najjar. ISBN: 978-953-51-0247-2, InTech, DOI: 10.5772/36154 (2012).
- [3] А.И. Максимов, В.А. Мошников, Ю.М. Таиров, О.А. Шилова. Основы золь-гель-технологии нанокомпозитов 2-е изд. СПб.: Элмор, 225 (2008)ю
- [4] А.С. Ильин, А.И. Максимов, В.А. Мошников, Н.П. Ярославцев. ФТП 39, 300 (2005).
- [5] В.С. Левицкий, А.И. Максимов, С.Ю Землякова. Изв. СПбГЭТУ "ЛЭТИ". 9, 23 (2011).
- [6] В.С. Левицкий, А.С. Леньшин, А.И. Максимов, Е.В. Мараева, В.А. Мошников. Сорбционные и хроматографические процессы 5, 725 (2012).
- [7] D. Gallant, M. Pezolet, S. Simard. Aqueous Media J. Phys. Chem. B 110, 6871 (2006).
- [8] E.M. Marsh, S.C. Petitto, G.S. Harbison, K.W. Wulser, M.A. Langell. J. Vac. Sci. Technol. A 23, 4, 1061 (2005).
- [9] V.G. Hadjiev, M.N. Iliev, I.V. Vergilov. J. Phys. C 21, 199 (1988).
- [10] В.С. Левицкий, А.С. Леньшин, А.И. Максимов, Е.В. Мараева, В.А. Мошников. Изв. вузов МЭТ 4, 48 (2012).
- [11] А.Е. Алексенский, М.В. Байдакова, А.Я. Вуль, В.Ю. Давыдов, Ю.А. Певцова. ФТТ 6, 1125 (1997).
- [12] В.С. Левицкий. Изв. СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 3, 3 (2013).
- [13] В.Г. Голубев, В.Ю. Давыдов, А.В. Медведев, А.Б. Певцов, Н.А. Феоктистов. ФТТ 8, 1348 (1997).